PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-174428

(43)Date of publication of application: 08.07.1997

(51)Int.CI.

B24B 37/04

(21)Application number: 07-340643

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

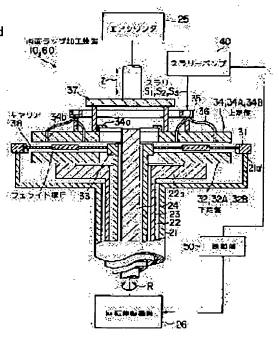
27.12.1995

(72)Inventor: KUNIYOSHI MASAAKI

(54) LAPPING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lapping method wherein the processing is not lengthened, equipment is reduced, and a preparation time is shortened. SOLUTION: With slurry for rough processing fed between ferrite DISC F and upper and lower surface plates 34 and 32, the upper and lower surface plates 34 and 32 are caused to effect relative movement based on the ferrite plate F. The freed grinding grains of grinding grains for rough machining are removed, and slurry for a middle finishing work is fed. Further, the upper and lower surface plates 34 and 32 are caused to effect relative movement, the slurry for a finishing work is fed, and the upper and lower surface plates 34 and 32 are caused to effect relative movement.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

•

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平9-174428

(43)公開日 平成9年(1997)7月8日

(51) Int. C1. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 2 4 B 37/04

B 2 4 B 37/04

Z

・審査請求 未請求 請求項の数3

OL

(全7頁)

(21)出願番号

特願平7-340643

(22)出願日

平成7年(1995)12月27日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 国吉 真暁

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術研究所内

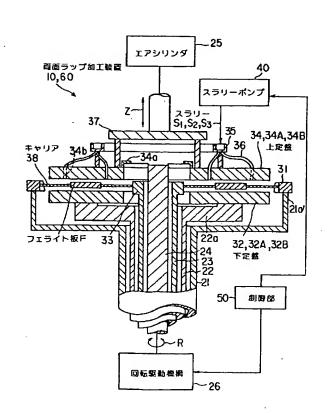
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】ラップ加工方法

(57)【要約】

【課題】加工時間を長くすることなく、設備を減らし、 かつ、段取り時間を短縮することができるラップ加工方 法を提供すること。

【解決手段】フェライト板Fと上定盤34及び下定盤3 2との間に荒加工用スラリーを供給する荒加工用スラリ 一供給工程と、上定盤34及び下定盤32をフェライト 板下に対して相対運動させるラップ定盤第1駆動工程 と、荒加工用砥粒のうち遊離したものを除去する遊離砥 粒除去工程と、中仕上げ加工用スラリーを供給する中仕 上げ加工用スラリー供給工程と、上定盤34及び下定盤 32を相対運動させるラップ定盤第2駆動工程と、仕上 げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用スラリー供給 工程と、上定盤34及び下定盤32を相対運動させるラ ップ定盤第3駆動工程とを備えるようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも砥粒とラップ液とからなるスラリーと、被加工物を挟持する上記砥粒よりも柔らかい材質からなるラップ定盤とを用いて上記被加工物をラップ加工するラップ加工方法において、

上記被加工物と上記ラップ定盤との間に所定粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを供給する荒加工用スラリー供給工程と、

上記ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させる ラップ定盤第1駆動工程と、

上記ラップ定盤上の上記荒加工用砥粒のうち遊離したも のを除去する遊離砥粒除去工程と、

上記被加工物と上記ラップ定盤との間に上記所定粒径の 略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含有する中 仕上げ加工用スラリーを供給する中仕上げ加工用スラリ 一供給工程と、

上記ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させる ラップ定盤第2駆動工程と、

上記被加工物と上記ラップ定盤との間に上記所定粒径の 略1/4の粒径を有する仕上げ加工用砥粒を含有する仕 20 上げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用スラリー供 給工程と、

上記ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させる ラップ定盤第3駆動工程とを備えていることを特徴とす るラップ加工方法。

【請求項2】少なくとも砥粒とラップ液とからなるスラリーと、被加工物を挟持する第1ラップ定盤と、上記被加工物を挟持する上記砥粒よりも柔らかい材質からなる第2ラップ定盤とを用いて上記被加工物をラップ加工するラップ加工方法において、

上記被加工物と上記第1ラップ定盤との間に所定粒径の 砥粒を含有する荒加工用スラリーを供給する荒加工用ス ラリー供給工程と、

上記第1ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第1駆動工程と、

上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記所定粒径の略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含有する中仕上げ加工用スラリーを供給する中仕上げ加工用スラリー供給工程と、

上記第2ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動さ 40 タイミングで供給し、遊離砥粒であるダイヤモンドでフせるラップ定盤第2駆動工程と、 ェライト板表面を研磨する構成となっている。

上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用スラリー供給工程と、

上記第2ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第3駆動工程とを備えていることを特徴とするラップ加工方法。

【請求項3】少なくとも砥粒とラップ液とからなるスラリーと、第1ラップ加工装置に搭載され被加工物を挟持 50

する第1ラップ定盤と、第2ラップ加工装置に搭載され 上記被加工物を挟持する上記砥粒よりも柔らかい材質か らなる第2ラップ定盤とを用いて上記被加工物をラップ 加工するラップ加工方法において、

上記被加工物と上記第1ラップ定盤との間に所定粒径の 砥粒を含有する荒加工用スラリーを供給する荒加工用ス ラリー供給工程と、

上記第1ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第1駆動工程と、

10 上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記所定粒 径の略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含有す る中仕上げ加工用スラリーを供給する中仕上げ加工用ス ラリー供給工程と、

上記第2ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第2駆動工程と、

上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用スラリー供給工程と、

20 上記第2ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第3駆動工程とを備えていることを特徴とするラップ加工方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ラップ加工方法に 関し、特に段取り時間及び設備の低減を図ることができ るものに関する。

[0002]

【従来の技術】錫ラップ定盤を用いたラップ加工装置は 30 量産部品の表面仕上げを行う装置として利用されてい る。特にスラリーとしてダイヤモンドスラリーを用いた ラップ加工装置はシリコンやフェライト等の硬脆材料の 簡便な精密量産加工法として多用されている。なお、ス ラリーは、ダイヤモンド等の砥粒をラップ液内に分散さ せ懸濁液としたものである。

【0003】従来のラップ加工装置のうち例えば4B型の両面ラップ加工装置は、相対向する上定盤と下定盤との間に被加工物として例えばフェライト板を配置し、上定盤に設けられた孔からダイヤモンドスラリーを所定のタイミングで供給し、遊離砥粒であるダイヤモンドでフェライト板表面を研磨する構成となっている。

【0004】このようなラップ定盤加工装置で例えばフェライト板を仕上げ加工する場合には、一般的に2つの方法がとられている。第1の方法は、荒加工、中仕上げ加工及び仕上げ加工を行うために、3種類のラップ定盤を用意し、最初に荒加工用として粒径1 μ mのダイヤモンド砥粒を含有するスラリーを供給し、荒加工用ラップ定盤をフェライト板に対し所定の相対運動をさせる。次に、フェライト板を取り出して洗浄・乾燥させた後、中仕上げ加工用のラップ定盤を用意し、中仕上げ加工用と

- 3

して粒径 1 / 2 μ m のダイヤモンド砥粒を含有するスラリーを供給し、中仕上げ加工ラップ定盤をフェライト板に対し所定の相対運動をさせる。さらに、フェライト板を取り出して洗浄・乾燥させた後、仕上加工用のラップ定盤を用意し、仕上げ加工用として粒径 1 / 4 μ m のダイヤモンド砥粒を含有するスラリーを供給し、仕上げ加工ラップ定盤をフェライト板に対し所定の相対運動をさせる。なお、このような方法をとる場合には、それぞれの加工精度に応じたラップ定盤がセットされた3台のラップ加工装置を用いてもよい。

【0005】第2の方法は、上記と同様にして荒加工した後、上記の中仕上げ加工を省略して、仕上げ加工を行うようにする。この場合には、用意するラップ加工装置又はラップ定盤を3台から2台に減らすことができるとともに、洗浄・乾燥等の段取り時間を短縮させることができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来のラップ加工方法にあっては、次のような問題があった。すなわち、第1の方法では各加工を行うためのラップ加工装置 20を3台又はラップ定盤を3台準備する必要があるとともに、各加工を終える毎に洗浄・乾燥を行わなければならず、多大の段取り時間を要し、量産には不向きであった。

【0007】一方、第2の方法では、中仕上げ加工がないため、設備を減らすことができるとともに、段取り時間を短縮することができる。しかし、荒加工した直後の状態から小さい粒径の砥粒を用いて仕上げ加工を行うため、加工時間が長くなるという問題があった。そこで本発明は、加工時間を長くすることなく、設備を減らし、かつ、段取り時間を短縮することができるラップ加工方法を提供することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を 達成するために、請求項1に記載された発明は、少なく とも砥粒とラップ液とからなるスラリーと、被加工物を 挟持する上記砥粒よりも柔らかい材質からなるラップ定 盤とを用いて上記被加工物をラップ加工するラップ加工 方法において、上記被加工物と上記ラップ定盤との間に 所定粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを供給する 荒加工用スラリー供給工程と、上記ラップ定盤を上記被 加工物に対して相対運動させるラップ定盤第1駆動工程 と、上記ラップ定盤上の上記荒加工用砥粒のうち遊離し たものを除去する遊離砥粒除去工程と、上記被加工物と 上記ラップ定盤との間に上記所定粒径の略半分の粒径を 有する中仕上げ加工用砥粒を含有する中仕上げ加工用ス ラリーを供給する中仕上げ加工用スラリー供給工程と、 上記ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させる ラップ定盤第2駆動工程と、上記被加工物と上記ラップ 定盤との間に上記所定粒径の略1/4の粒径を有する仕 50 上げ加工用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用スラリー供給工程と、上記ラップ定盤を上記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第3 駆動工程とを備えるようにした。

【0009】請求項2に記載された発明は、少なくとも 砥粒とラップ液とからなるスラリーと、被加工物を挟持 する第1ラップ定盤と、上記被加工物を挟持する上記砥 粒よりも柔らかい材質からなる第2ラップ定盤とを用い て上記被加工物をラップ加工するラップ加工方法におい て、上記被加工物と上記第1ラップ定盤との間に所定粒 径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを供給する荒加工 用スラリー供給工程と、上記第1ラップ定盤を上記被加 工物に対して相対運動させるラップ定盤第1駆動工程 と、上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記所 定粒径の略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含 有する中仕上げ加工用スラリーを供給する中仕上げ加工 用スラリー供給工程と、上記第2ラップ定盤を上記被加 工物に対して相対運動させるラップ定盤第2駆動工程 と、上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記所 定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工用砥粒を含 有する仕上げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用ス ラリー供給工程と、上記第2ラップ定盤を上記被加工物 に対して相対運動させるラップ定盤第3駆動工程とを備 えるようにした。

【0010】請求項3に記載された発明は、少なくとも 砥粒とラップ液とからなるスラリーと、第1ラップ加工 装置に搭載され被加工物を挟持する第1ラップ定盤と、 第2ラップ加工装置に搭載され上記被加工物を挟持する 上記砥粒よりも柔らかい材質からなる第2ラップ定盤と を用いて上記被加工物をラップ加工するラップ加工方法 において、上記被加工物と上記第1ラップ定盤との間に 所定粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを供給する 荒加工用スラリー供給工程と、上記第1ラップ定盤を上 記被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第1駆動 工程と、上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上 記所定粒径の略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒 を含有する中仕上げ加工用スラリーを供給する中仕上げ 加工用スラリー供給工程と、上記第2ラップ定盤を上記 被加工物に対して相対運動させるラップ定盤第2駆動工 程と、上記被加工物と上記第2ラップ定盤との間に上記 所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工用砥粒を 含有する仕上げ加工用スラリーを供給する仕上げ加工用 スラリー供給工程と、上記第2ラップ定盤を上記被加工 物に対して相対運動させるラップ定盤第3駆動工程とを 備えるようにした。

【0011】上記手段を講じた結果、次のような作用が生じる。すなわち、請求項1に記載された発明では、所定粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを用いて、ラップ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被加工物の荒加工を行うことができる。このとき、砥粒は

ラップ定盤よりも硬いので、一部の砥粒がラップ定盤に 埋まり、上記所定粒径の略1/2の粒径の砥粒と等価の 状態となる。この状態で遊離砥粒を除去する。次に、所 定粒径の略1/2の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を 含有する中仕上げ加工用スラリーを用いて、ラップ定盤 と被加工物とを相対運動させることにより、被加工物の 中仕上げ加工を行うことができる。このとき、砥粒はラ ップ定盤よりも硬いので、砥粒がラップ定盤に埋まり、 所定粒径の略1/4の粒径の砥粒と等価の状態となる。 さらに、所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工 10 用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを用いて、ラッ プ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被加 工物の仕上加工を行うことができる。

【0012】請求項2に記載された発明は、所定粒径の 砥粒を含有する荒加工用スラリーを用いて、第1ラップ 定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被加工 物の荒加工を行うことができる。次に、所定粒径の略半 分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含有する中仕上 げ加工用スラリーを用いて、第2ラップ定盤と被加工物 とを相対運動させることにより、被加工物の中仕上げ加 工を行うことができる。このとき、砥粒は第2ラップ定 盤よりも硬いので、砥粒が第2ラップ定盤に埋まり、所 定粒径の略1/4の粒径の砥粒と等価の状態となる。さ らに、所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工用 砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを用いて、第2ラ ップ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被 加工物の仕上加工を行うことができる。

【0013】請求項3に記載された発明は、所定粒径の 低粒を含有する荒加工用スラリーを用いて、第1ラップ 定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被加工 30 物の荒加工を行うことができる。次に、所定粒径の略半 分の粒径を有する中仕上げ加工用低粒を含有する中仕上 げ加工用スラリーを用いて、第2ラップ定盤と被加工物 とを相対運動させることにより、被加工物の中仕上げ加 工を行うことができる。このとき、砥粒は第2ラップ定 盤よりも硬いので、砥粒が第2ラップ定盤に埋まり、所 定粒径の略1/4の粒径の砥粒と等価の状態となる。さ らに、所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工用 砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを用いて、第2ラ ップ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被 加工物の仕上加工を行うことができる。

[0014]

【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施の形態に係る4B型の両面ラップ加工装置10を示す縦断面図である。両面ラップ加工装置10は、装置本体20と、この装置本体20にスラリーSを供給するスラリーポンプ40と、装置本体20及びスラリーポンプ40を制御する制御部50とを備えている。

【0015】装置本体20は、同軸的に配置された第1 駆動軸21, 第2駆動軸22, 第3駆動軸23及び第4 50

駆動軸24と、後述する上定盤34に所定圧力をかける エアシリンダ25と、第1~第4駆動軸21~24を図 1中矢印R方向にそれぞれ独立に回転駆動する回転駆動 機構26とを備えている。

【0016】第1駆動軸21の図1中上端は円筒状の支持部21aが形成され、この支持部21aの開口部には周状に亘って内歯車31が形成されている。第2駆動軸22の図1中上端は円環状の支持部22aが形成され、この支持部22aの上面には錫材製の下定盤32が支持されている。第3駆動軸23の図1中上端は外歯車33が形成されている。第4駆動軸24の図1中上端は後述するフック34aを介して着脱自在に円環状の錫材製の上定盤34が支持されている。なお、上定盤34と下定盤32とは相対向している。

【0017】上定盤34の中央部にはフック34aが形成されており、第4駆動軸24の上端に係合させることで第4駆動軸24の回転力が伝達される。一方、上定盤34には図1上下を連通する12個の連通孔34bが設けられており、後述するパイプ36から供給されたスラリーSを上定盤34と下定盤32との間にほぼ均一に供給する機能を有している。

【0018】上定盤34の図1中上面には環状路35が取り付けられており、スラリーポンプ40より供給されたスラリーSが流入するように形成されている。環状路35の底部には12個の孔が設けられ、それぞれにパイプ36の一端が取り付けられている。パイプ36の他端は上定盤34の連通孔34bに接続されている。

【0019】さらに上定盤34は同軸的に吊り下げ部37により吊り下げられており、この吊り下げ部37はエアシリンダ25の下端に回転自在、かつ図1中矢印2方向に移動自在に支持されている。

【0020】なお、図1中38はその外周に上述した内 歯車31及び外歯車33と噛み合うギアを有し、フェライト板(被加工物)Fを支持するキャリアを示している。スラリーポンプ40は、ラップ液L中に粒径1 μ m のダイヤモンド砥粒D1を分散させたスラリーS1、ラップ液L中に粒径1 $/2\mu$ mのダイヤモンド砥粒D2を分散させたスラリーS2、ラップ液L中に粒径1 $/4\mu$ mのダイヤモンド砥粒D3を分散させたスラリーS3を後述するタイミング及び量で吐出するように形成されている。

【0021】制御部50は、後述するように回転駆動機構26及びスラリーポンプ40が作動するように制御する機能を有している。このように構成された両面ラップ加工装置10では、次のようにしてラップ加工を行う。すなわち、上定盤34と下定盤32をセットし、修正及び洗浄・乾燥を行う。次にフェライトFをキャリア38にセットし、キャリア38を内歯車31及び外歯車33に噛み合うようにセットする。次に制御部50によりスラリーポンプ40から7~10ccのスラリーS1を吐

出し、環状路35及びパイプ36を介して均一に連通孔 34 bにスラリーS1を供給する。

【0022】連通孔34bによりスラリーS1が上定盤 34と下定盤32との間に供給されると同時に、エアシ リンダ25により上定盤34に図1中下向きの荷重8k gfをかけるとともに、回転駆動機構26により第1~ 第4駆動軸21~24を駆動開始する。このとき、上定 盤の回転数は13rpm、下定盤の回転数は40rpm とする。この回転に伴いキャリア38が上定盤34及び 下定盤32に対して相対運動を行い、フェライト板F表 10 面は均一にスラリーS1中の砥粒D1により研磨され る。

【0023】図2の(a)~(c)はこのようなラップ 加工動作に伴う下定盤32とフェライト板F及びスラリ ーSとの関係を模式的に示す図である。なお、上定盤3 4との関係は下定盤32との関係と同様であるので省略 する。

【0024】回転駆動機構26による駆動開始直後は図 2の(a)に示すようにフェライト板Fと下定盤32と された状態である。この混合された状態の砥粒D1が回 転したり、すべったりしてフェライト板F表面が研磨さ れ、荒加工が行われる。

【0025】時間が経過すると図2の(b), (c)に 示すように砥粒D1のうちの一部の砥粒D1'が上述し たエアシリンダ25によって付与された荷重によりダイ ヤモンドの砥粒 D1より柔らかい錫材製の下定盤32に 徐々に埋め込まれる。

【0026】1時間経過後、回転駆動機構26による駆 動を停止し、エアシリンダ25による上定盤34への荷 重負荷を解除する。そして、スラリーS1を拭き取るこ とにより、上定盤34及び下定盤32から遊離している 砥粒D1を除去する。

【0027】次にスラリーポンプ40からスラリーS2 を吐出する。なお、このときのスラリーS2の量は3分 間で10ccとなるように吐出し、8分間吐出停止、3 分間吐出を繰り返す。スラリーS2が上定盤34と下定 盤32との間に供給されると同時に、エアシリンダ25 により上定盤34に図1中下向きの荷重8kgfをかけ るとともに、回転駆動機構26により第1~第4駆動軸 40 21~24を駆動開始する。このとき、上定盤の回転数 は13rpm、下定盤の回転数は40rpmとする。こ の回転に伴いキャリア38が上定盤34及び下定盤32 に対して相対運動を行い、フェライト板F表面は均一に スラリーS2中の砥粒D2及び上定盤34と下定盤32 に埋め込まれた砥粒D1により研磨される。このとき、 砥粒D1は上定盤34と下定盤32に埋め込まれている ので、粒径が1/2の砥粒D2と等価の働きをし、中仕 上げ加工が行われる。

【0028】なお、スラリーS中の砥粒D2は時間経過 50

に伴い、図2に示す砥粒D1と同様に上定盤34及び下 定盤32に埋め込まれる。1時間経過後、スラリーポン プ40からスラリーS3を吐出する。なお、このときの スラリーS3の量は3分間で10ccとなるように吐出 し、8分間吐出停止、3分間吐出を繰り返す。上定盤3 4及び下定盤32の回転に伴いキャリア38が上定盤3. 4 及び下定盤32に対して相対運動を行い、フェライト 板F表面は均一にスラリーS3中の砥粒D3及び上定盤 34と下定盤32に埋め込まれた砥粒D2により研磨さ れる。このとき、砥粒D2は上定盤34と下定盤32に 埋め込まれ、粒径が1/4の砥粒D3と等価の働きをす るため、仕上げ加工が行われる。

【0029】上述した第1の実施の形態に係る4B型の 両面ラップ加工装置10では、1台のラップ加工装置 で、かつ、上定盤34及び下定盤32とを取り替えるこ となく荒加工、中仕上げ加工、仕上加工を行うことがで きる。このため、ラップ定盤を2種類用い、ラップ加工 装置が2台必要である上、加工時間が3時間である上述 した第2の方法と比較すると、加工時間は同じである. の間のスラリーS1は、ラップ液Lと砥粒D1とが混合 20 が、ラップ定盤は1種類であり、フェライト板Fの移し 替え及び洗浄・乾燥が不要である。このため、加工時間 を長くすることなく設備を減らし、かつ、段取り時間を 不要とすることができる。

> 【0030】次に、本発明の第2の実施の形態に係る4 B型の両面ラップ加工装置60について説明する。な お、本装置の構成は上述した両面ラップ加工装置10と 同様に構成されているので、詳細な説明は省略する。本 両面ラップ加工装置60が上述した両面ラップ加工装置 60と異なる点は、上定盤34及び下定盤32に代わり にそれぞれ上定盤34A,34B及び下定盤32A,3 2 Bを用い、荒加工が終了した時点で取り替える点にあ る。なお、上定盤34A及び下定盤32Aは荒加工用の ラップ盤であり、上定盤34B及び下定盤32Bは仕上 加工用の錫材製のラップ盤である。

【0031】両面ラップ加工装置60では、次のように してラップ加工を行う。すなわち、上定盤34Aと下定 盤32Aをセットし、修正及び洗浄・乾燥を行う。次に フェライトFをキャリア38にセットし、キャリア38 を内歯車31及び外歯車33に噛み合うようにセットす る。次に制御部50によりスラリーポンプ40から7~ 10 c c のスラリーS1を吐出し、環状路35及びパイ プ36を介して均一に連通孔34bにスラリーS1を供 給する。そして、両面ラップ加工装置10と同様にし て、フェライト板F表面は均一にスラリーS1中の砥粒 D1により研磨され、荒加工が行われる。

【0032】30分経過後、回転駆動機構26による駆 動を停止し、エアシリンダ25による上定盤34への荷 重負荷を解除する。そして、フェライト板Fを一時的に 取り外し、洗浄、乾燥させるとともに、両面ラップ加工 装置60から上定盤34A及び下定盤32Aを取り外

し、上定盤34B及び下定盤32Bを取り付ける。

【0033】フェライト板Fを再度セットした後、スラリーポンプ40からスラリーS2を吐出する。なお、このときのスラリーS2の量は3分間で10ccとなるように吐出し、8分間吐出停止、3分間吐出を繰り返す。同様にしてフェライト板F表面は均一にスラリーS2中の砥粒D2により研磨され、中仕上げ加工が行われる。なお、スラリーS中の砥粒D2は時間経過に伴い、上定盤34B及び下定盤32Bに埋め込まれる。

【0034】30分間経過後、スラリーポンプ40からスラリーS3を吐出する。なお、このときのスラリーS3の量は3分間で10ccとなるように吐出し、8分間吐出停止、3分間吐出を繰り返す。上定盤34B及び下定盤32Bの回転に伴いキャリア38が上定盤34B及び下定盤32Bに対して相対運動を行い、フェライト板F表面は均一にスラリーS3中の砥粒D3及び上定盤34Bと下定盤32Bに埋め込まれた砥粒D2により研磨される。このとき、砥粒D2は上定盤34Bと下定盤32Bに埋め込まれ、粒径が1/4の砥粒D3と等価の働きをするため、仕上げ加工が行われる。

【0035】上述した第2の実施の形態に係る4B型の両面ラップ加工装置60では、2種類の上定盤34A,34B及び下定盤32A,32Bとを用いて荒加工、中仕上げ加工、仕上加工を行うことができる。このため、ラップ定盤を3種類用い、加工時間が2時間であり、フェライト板Fの移し替え及び洗浄・乾燥が各2回行う上述した第1の方法と比較すると、加工時間は同じであるが、ラップ定盤は2種類であり、フェライト板Fの移し替え及び洗浄・乾燥が各1回である。このため、加工時間を長くすることなく設備を減らし、かつ、段取り時間30を短縮することができる。

【0036】なお、本第2実施の形態では、1台の両面ラップ加工装置において2種類のラップ定盤、すなわち上定盤34A,34B及び下定盤32A,32Bを用いる場合について説明したが、2台の両面ラップ加工装置を用いるようにしてもよい。すなわち、上定盤34A及び下定盤32Aが設けられ荒加工を行うための両面ラップ加工装置と、上定盤34B及び下定盤32Bが設けられ中仕上げ加工及び仕上げ加工を行うための両面ラップ加工装置とを用いる。したがって、上定盤34A及び下40定盤32Aがセットされた両面ラップ加工装置においてフェライト板Fを荒加工した後、フェライト板の洗浄・乾燥を行い、上定盤34B及び下定盤32Bがセットされた両面ラップ加工装置において中仕上げ加工及び仕上げ加工を行う。

【0037】このため、両面ラップ加工装置を3台用い、加工時間が2時間であり、フェライト板Fの移し替え及び洗浄・乾燥が各2回行う上述した第1の方法と比較すると、加工時間は同じであるが、両面ラップ加工装置は2台であり、フェライト板Fの移し替え及び洗浄・

乾燥が各1回である。このため、加工時間を長くすることなく設備を減らし、かつ、段取り時間を短縮することができる。

【0038】なお、本発明は上述した各実施の形態に限定されるものではない。すなわち前記した実施の形態では、4B型の両面ラップ加工装置を用いたが、他の規格のラップ加工装置を用いてもよい。また、両面加工装置の代わりに片面加工装置を用いてもよい。さらに、砥粒としてダイヤモンドを用いたが、定盤や被加工物の材質に合わせて他の砥粒を用いてもよい。さらにまた、ポリシング加工にも適用できる。このほか本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能であるのは勿論である。

[0039]

【発明の効果】請求項1に記載された発明によれば、所 定粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを用いて、ラ ップ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被 加工物の荒加工を行うことができる。このとき、砥粒は ラップ定盤よりも硬いので、一部の砥粒がラップ定盤に 20 埋まり、上記所定粒径の略1/2の粒径の砥粒と等価の 状態となる。この状態で遊離砥粒を除去する。次に、所 定粒径の略1/2の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を 含有する中仕上げ加工用スラリーを用いて、ラップ定盤 と被加工物とを相対運動させることにより、被加工物の 中仕上げ加工を行うことができる。このとき、砥粒はラ ップ定盤よりも硬いので、砥粒がラップ定盤に埋まり、 所定粒径の略1/4の粒径の砥粒と等価の状態となる。 さらに、所定粒径の略1/4の粒径を有する仕上げ加工 用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを用いて、ラッ プ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、被加 工物の仕上加工を行うことができる。

【0040】請求項2に記載された発明によれば、所定 粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを用いて、第1 ラップ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、 被加工物の荒加工を行うことができる。次に被加工物を 第1ラップ定盤から第2ラップ定盤へ移載した後、所定 粒径の略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含有 する中仕上げ加工用スラリーを用いて、第2ラップ定盤 と被加工物とを相対運動させることにより、被加工物 中仕上げ加工を行うことができる。このとき、プ定盤 2ラップ定盤よりも硬いので、砥粒が第2ラップ定盤より 中性上げ加工を行うことができる。 2ラップ定盤よりも硬いので、砥粒が第2ラップ定盤に 埋まり、所定粒径の略1/4の粒径を有する仕 上げ加工用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを用い て、第2ラップ定盤と被加工物とを相対運動させること により、被加工物の仕上加工を行うことができる。

【0041】請求項3に記載された発明によれば、所定 粒径の砥粒を含有する荒加工用スラリーを用いて、第1 ラップ定盤と被加工物とを相対運動させることにより、 被加工物の荒加工を行うことができる。次に被加工物を

第1ラップ定盤から第2ラップ定盤へ移載した後、所定 粒径の略半分の粒径を有する中仕上げ加工用砥粒を含有 する中仕上げ加工用スラリーを用いて、第2ラップ定盤 と被加工物とを相対運動させることにより、被加工物の 中仕上げ加工を行うことができる。このとき、砥粒は第 2ラップ定盤よりも硬いので、砥粒が第2ラップ定盤に 埋まり、所定粒径の略1/4の粒径の砥粒と等価の状態 となる。さらに、所定粒径の略1/4の粒径を有する仕 上げ加工用砥粒を含有する仕上げ加工用スラリーを用い て、第2ラップ定盤と被加工物とを相対運動させること 10 により、被加工物の仕上加工を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1及び第2の実施の形態に係る両面 ラップ加工装置を示す縦断面図。

【図2】同装置によるラップ加工動作に伴う下定盤とフェライト板とスラリーとの関係を模式的に示す説明図。

【符号の説明】

10,60…両面ラップ加工装置

20…装置本体

21…第1駆動軸

22…第2駆動軸

23…第3駆動軸

24…第4駆動軸

25…エアシリンダ

26…回転駆動機構

0 32, 32A, 32B…下定盤

34, 34A, 34B…上定盤

35…環状路

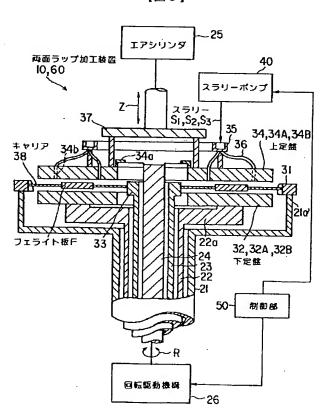
36…パイプ

38…キャリア

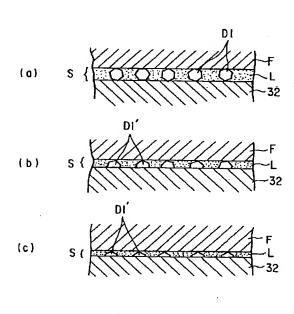
40…スラリーポンプ

50…制御部

【図1】



【図2】



THIS PAGE BLANK (USPTO